

Технологии National Instruments в построении измерительных стендов для тестирования полупроводниковых элементов и СВЧ устройств

15 ноября 2013 г.

Начало семинара в 9:00

г. Красноярск, Сибирский Федеральный университет

ул. Киренского, 28

корпус Б ауд. 420

Платформа National Instruments PXI/PXI Express

- Технология модульных приборов PXI - платформа для разработки комплексных контрольно-измерительных, регистрирующих и диагностических систем.
- Осциллографы, генераторы, мультиметры, цифровые генераторы/анализаторы, векторные генераторы/анализаторы спектра, источники питания, счётчики/таймеры, коммутаторы.
- Возможности высокоточной синхронизации модульных приборов PXI. Возможности модульной платформы.

Построение испытательных стендов на базе приборов PXIe

- Создание многоканальных испытательных комплексов любой сложности на базе приборов PXI
- Комплексы для тестирования цифровых микросхем, АЦП, ЦАП
- Испытания элементной базы. Входной/выходной контроль
- Вопросы метрологии и сертификации испытательных систем
- NI LabVIEW 2013 - среда графической разработки измерительных и тестовых процедур. Разработка ПО для приёма, генерации и обработки сигналов.
- NI TestStand 2013 – среда с готовой инфраструктурой для управления испытаниями

Демонстрация оборудования

Обзор решений пользователей

Обсуждение ваших приложений с инженерами National Instruments

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации.

Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас и Ваших коллег способ регистрации на семинар:

1. По email

Для этого отправьте письмо с указанием наименования института, ФИО участников, телефона и электронного адреса на email: mav137@yandex.ru

2. По телефону 2912 - 209

Контактная информация:

Мишуров Андрей 8-902-992-3599.